Search Notes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/531,190	IACOVELLA ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Chuc D. Tran	2821	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
343	713,711	3/17/2006	тс
343	872,725	3/17/2006	TC
343	712,715	3/17/2006	TC
343	700 MS	3/17/2006	TC
	·		•
		10	
٠			
		`	
	· .		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
343	713	3/17/2006	тс	
343	711	3/17/2006	TC	
		3/17/2006	тс	
Interferen Hist		3/17/2006	тс	

SEARCH NOT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DATE	EXMR
BRS Consulted with Primary David Phan	3/17/2006	тс
•		
	•	<u> </u>
	I	İ
	1 · ·	
·		
		·